



SELEZIONE N. 2023S19, PER TITOLI ED ESAMI, AL FINE DI REPERIRE N. 1 TECNOLOGO DI RICERCA, DI PRIMO LIVELLO (CATEGORIA STIPENDIALE PARI A “EP1”), DA ASSUMERE MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE, A TEMPO PIENO, PER N. 24 MESI, AI SENSI DELL’ART. 24-BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240, E DEL C.C.N.L. DEL 19.04.2018, IN QUANTO COMPATIBILE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA “GALILEO GALILEI” - DFA.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteria di valutazione dei titoli

La Commissione procede, in via preliminare, a determinare i criteri generali per la valutazione dei titoli previsti dall’avviso di selezione e, dopo ampia discussione, tenendo in considerazione il profilo professionale e le caratteristiche proprie del posto messo a concorso, approva all’unanimità le categorie dei titoli da considerare ed i relativi punteggi da attribuire come segue:

CATEGORIE DI TITOLI	TOT. MAX 30 PUNTI
1) esperienza di lavoro su apparati di deposizione fisica da fase vapore (PVD): <ul style="list-style-type: none">• magnetron sputtering: punti 3• ion beam sputtering: punti 3• atomic layer deposition: punti 1• pulsed laser deposition: punti 1	max 8 punti
2) esperienza di utilizzo di tecniche di analisi fisico-chimica applicate allo studio di film sottili: <ul style="list-style-type: none">• ellissometria: punti 2• microscopia elettronica a scansione: punti 1• tecniche di indagine elementale con fasci ionici: punti 2• microscopia a forza atomica: punti 1• diffrazione e riflettometria di raggi X: punti 2	max 8 punti
3) esperienza di servizio in laboratori multiutente: <ul style="list-style-type: none">• formazione tecnico/scientifica di personale all’uso delle attrezzature del laboratorio: punti 2• assistenza all’utenza e coordinamento della stessa: punti 2• gestione di forniture e magazzino: punti 2	max 6 punti
4) titolarità di pubblicazioni su rivista scientifica inerenti alle tematiche di modellazione, fabbricazione e/o caratterizzazione di film sottili: <ul style="list-style-type: none">• il candidato è autore o co-autore di una pubblicazione inerente la modellazione, le tecniche di deposizione e/o caratterizzazione di film sottili (0,5 pti per ogni pubblicazione): fino a max punti 2• il candidato è primo autore di una delle pubblicazioni di cui sopra (0,25 pti aggiuntivi per ogni pubblicazione): fino a max punti 1	max 3 punti
5) attinenza della tesi di dottorato e di eventuali master e/o corsi di formazione alle tematiche di modellazione, fabbricazione e/o caratterizzazione di film sottili: <ul style="list-style-type: none">• tesi di dottorato: punti 2• master: punti 2	max 4 punti
6) titolarità di brevetti inerenti alle tematiche di modellazione, fabbricazione e/o caratterizzazione di film sottili:	max 1 punti

Criteria di valutazione della prova scritta

La Commissione, unanimemente, stabilisce che la prova scritta a risposta aperta consisterà di n. 2 domande, che avranno lo stesso peso e verranno valutate in base ai seguenti criteri:

DOMANDA	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Domanda 1	correttezza: punti 5 completezza: punti 5 coerenza: punti 5	punti 15
Domanda 2	correttezza: punti 5 completezza: punti 5 coerenza: punti 5	punti 15

Criteria di valutazione del colloquio

La Commissione, unanimemente, stabilisce che il colloquio consisterà di n. 3 domande, che avranno lo stesso peso e verranno valutate in base ai seguenti criteri:

DOMANDA	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Domanda n. 1	correttezza: punti 5 completezza: punti 5	punti 10
Domanda n. 2	correttezza: punti 5 completezza: punti 5	punti 10
Domanda n. 3	correttezza: punti 5 completezza: punti 5	punti 10